BL19B2

液相界面ボトムアップ法による分離膜向け分子ナノシートの創製と 構造解析

Structural Analysis of Molecular Nanosheets for Separation Membrane Assembled with a Bottom–Up Approach at Liquid Interfaces

大畑 孝司 ^a, 廣沢 一郎 ^b, 渡辺 剛 ^b, <u>牧浦 理恵</u> ^a Takashi Ohata^a, Ichiro Hirosawa^b, Takeshi Watanabe^b, <u>Rie Makiura</u>^a

^a大阪府立大学 大学院工学研究科,^b高輝度光科学研究センター 産業利用推進室 ^aOsaka Prefecture University,^bJASRI,

配位高分子は、有機分子を主成分とした多孔性物質であり、有機分子の設計性を生かし、細孔サイズや形状を多様且つ容易に変化させることができる。そのため、ナノシート化により、透過性と選択性を兼ね備えた分離膜としての応用が期待される。これまでに、気液界面を用いて配位高分子ナノシートの作製に成功しているが、ナノシートの形成状態(厚さ、面積、結晶化度)に影響を及ぼす条件因子、ガス選択性や透過性は未解明である。本課題においては、固体基板に転写した配位高分子ナノシートの構造評価及び気液界面におけるナノシート形成過程解明のためのその場測定に向けた条件確認を行った。波長 0.124 nm における微小角入射 X 線回折 (GIXRD) 測定を行い、in-plane および out-of-plane 測定の両方に関してピークが得られていることから、配位高分子ナノシートは高い結晶性を有し、さらに基板に対して配向していることがわかった。また、ビーム打ち下ろし設定における水表面からの全反射の確認を行った。

キーワード: 分離膜、ナノシート、配位高分子、気液界面、微小角X線回折

背景と研究目的:

物質の分離・精製は、環境、エネルギー、化学工業などにお いて不可欠な操作である。膜による混合物の分離は、吸着分離 や深冷分離などに比べ簡便かつ省エネルギーな方法として重要 視されている。分離膜の材料としては、主にポリイミドなどの 有機ポリマーが用いられており、作製が容易である一方、細孔 径には分布が生じる。それゆえに、選択性(分離効率)を向上 させるためには適度な厚みが必要であるが、厚すぎると透過性

(生産性)が低下するというトレードオフの関係が Robeson upper bounds として知られている[1]。分離効率と生産性の両方 を向上させるために、分子スケールでサイズの定まった規則ナ ノ細孔を有する極めて薄い膜(以降ナノシートと呼ぶ)の開発 が強く望まれている(図1上)。その候補として、配位高分子な どの、有機分子を主成分とする結晶性固体が挙げられる[2,3]。 有機分子の設計性を生かし、細孔サイズや形状を多様且つ容易 に変化させることができる。しかしながら、一般的に用いられ る合成方法では微結晶粉末として得られるため、そのナノシー ト化が大きな課題である。

申請者らはこれまでに、配位高分子ナノシートの作製に成功 し、SPring-8 BL13XUにおいて実施した構造評価により得られ



た成果を報告している[4, 5]。これは結晶性且つ完全配向した配位高分子超薄膜の初めての例であり、 気体と液体が接する2次元界面において形成されている点が特徴である(図1下)。一方で、この手法 を適用できる分子の種類やナノシートの形成状態(厚さ、面積、結晶化度)に影響を及ぼす条件因子、 ガス選択性や透過性は未解明である。そこで、本研究ではこれらの点を明らかにし、究極の性能を有 する分離膜開発に向けた原理確認を行う。そのために、得られた薄膜の構造解析は必須である。固体 基板に転写後のナノシートの構造評価に加え、気液界面におけるその場X線回析測定を行い、界面で 分子が連結し長周期構造を形成する過程を逐次把握する。

実験:

【試料】

基板: Si (100) (表面は自然酸化膜)

試料:基板表面に作製された有機分子(トリフェニレン誘導体(図2))からなるナノシート(吸収スペクトル及び走査型顕微鏡より、膜の厚さ、ドメインサイズ、銅線源を用いたX線回折装置にて想定ピーク位置を予め確認してある試料)



トリフェニレン誘導体

図2

【波長】 0.124 nm (10 keV)

【回折計】

測定は BL19B2 に設置されている多軸回折装置を用いて行った。

受光側は2基の四象限スリット(入射側:横6mm、縦0.3mm、受光側:横10mm、縦4mm)と ソーラースリット(発散角度 0.19°)でコリメーションを形成した。

【試料の固定】

試料は BL に準備されている標準的な試料ホルダーを用いて試料を保持し、BL に備え付けの He カプトンドーム内に収納した。

【試料位置調整】

試料面法線が回折装置の φ 軸と並行になるように試料を設置した。BL で一般的に用いられている マクロコマンドを使用して試料位置調整を行った。

【測定法】

微小角入射 in-plane X 線回折 (GI in-plane XRD) 測定: GI in-plane XRD 測定は、試料表面への入射 角及び散乱 X 線の take-off 角が常に 0.15°になる条件で、散乱角(two theta 角)3°から 45°の範囲を 備え付けのマクロコマンドを用いて 20xy 走査測定を行った。

Out-of-plane X 線回折測定: Out-of-plane XRD 測定は、散乱角(two theta 角)3°から 30°の範囲を備 え付けのマクロコマンドを用いて θ -2 θ_z 走査測定を行った。また、散乱角が 1°から 10°の範囲におい ては、自動アッテネーターのプログラムにより測定した。

ビーム打ち下ろし設定:気液界面における直接測定に向け、Si単結晶を用いたビーム打ち下ろし設定における水の全反射の確認を行った。

結果および考察:

作製条件(溶媒、濃度)の異なる3種類のナノシート(NS: Nanosheet, NS1, NS2, NS3)に関して、GI in-plane XRD プロファイルおよび out-of-plane XRD プロファイルを図3に示す。全ての試料において、in-plane および out-of-plane 測定の両方に関してピークが得られていることから、結晶性を有することが確認された。ピーク位置の解析から得られた結晶系は六方晶で、格子定数はa=b=21.292(8) Å、c=3.23(1) Åであった。In-plane XRD と out-of-plane XRD のプロファイルは全く異なり、共通のピークが見られないことから、NS は配向(液面に対して垂直方向を c 軸とすると、c 軸配向)していることがわかった。3 つの試料に関して、ピークの数及び位置は一致していることから、結晶中の分子配向は同じであると考えられるが、ピークの強度及び線幅には違いが見られ、気液界面における作製条件が NS の結晶性やドメインサイズに影響を与えることが示唆された。



図3 トリフェニレン誘導体からなる配位高分子ナノシート(作製条件の異なる3種類のナノシート, NS1, NS2, NS3)の Gl in-plane XRD プロファイル(左)と out-of-plane プロファイル(右)

NSの加熱に伴う GI in-plane XRD プロファ イルの変化を図4に示す。200°C までは室温 と同様の XRD プロファイルを示しているこ とから、この温度まで結晶性が保たれること が明らかになった。また、50°C においては、 室温よりもピーク強度が大きくなっており、 低温における加熱が結晶性の向上への効果が あることが示唆された。

今後の、気液界面における直接測定に向け、 ガラス容器に水を満たし、シリコン結晶によ りビームを打ち下ろしすることにより、水の 全反射を確認した。

今後の課題:

本実験課題においては、気液界面にて作製 した配位高分子ナノシートを、シリコン基板 に転写後、XRD 測定により構造評価を行った。 本研究で目的とするナノシートの形成過程の 解明及び作製条件因子がナノシートの形成状 態に与える影響の解明を達成するためには、 Temperature dependence of GI in-plane XRD profile



気液界面におけるその場測定が必要である。今後は、打ち下ろし測定によるその場測定に向けた光学系の整備を進める必要がある。

参考文献:

[1] L. M. Robeson, J. Membr. Sci, 320, 390 (2008).

[2] S. Kitagawa, R. Kitaura and S. Noro, Angew. Chem., Int. Ed., 43, 2334 (2004).

- [3] H.-C. Zhou, J. R. Long and O. M. Yaghi, Chem. Rev., 112, 673 (2012).
- [4] 牧浦理恵 他, 平成 21 年度 重点ナノテクノロジー支援課題報告書(2009A), 2009A1703.

[5] R. Makiura, S. Motoyama, Y. Umemura, H. Yamanaka, O. Sakata and H. Kitagawa, Nat. Mater., 9, 565 (2010).

©JASRI

(Received: June 29, 2017; Early edition: November 24, 2017; Accepted: December 18, 2017; Published: January 25, 2018)